

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

アドバンテスト、MEMS センサ試験市場に参入

MEMS センサの低コスト量産試験に最適なテスト・システム 「V93000 Smart Scale」をフリースケール・セミコンダクタ社に納品

株式会社アドバンテスト(本社:東京都千代田区 社長:松野晴夫)のテスト・システム「V93000 Smart Scale™」が、MEMS センサの開発および生産用として、フリースケール・セミコンダクタ社の世界各地の拠点に設置されました。本件は、今後も高成長が期待される MEMS センサ市場における、当社テスト・システムの本格的参入となります。

「V93000 Smart Scale」は、「Pin Scale 1600」デジタル・モジュールを搭載し、センサの量産において業界で最も優れたテスト・コストをお届けします。小型のテスト・ヘッド「A-Class」と、充実したシステム・リソース、そして当社独自技術による「ユニバーサル・ピン・アーキテクチャ」は、将来のセンサ試験においても他社製品には無い試験効率を実現します。

MEMS センサ試験の成否の鍵は、センサをさまざまな方向に揺り動かす MEMS ハンドラとの接続にあります。「V93000 Smart Scale」は、MEMS ハンドラの主要製品全てに対応し、テスト・フローにおいてスムーズな連携を取ることができます。

「フリースケール社は、MEMS センサの技術的要求を満たすソリューションを求めて、さまざまなテスト・システムをレビューしました。最終的に同社のニーズにマッチしたのは、『V93000 Smart Scale』の高い費用効率と、『Pin Scale 1600』の優れた量産性能、そして我々の 24 時間体制のサポート・サービスでした。」アドバンテスト常務執行役員 営業本部長 明 世範はこのように述べました。

フリースケール社は以前より、同社のさまざまな半導体の開発および生産用に「V93000」を採用してきました。アジア全域に広がる同社の生産外注先(OSAT)は「V93000」を使用しています。同社の Sensor and Actuator Solutions Division の統括責任者である Sayed Paransun 氏からは、「『V93000』は、MEMS センサのテスト・コストの削減と、タイムリな新製品投入を可能にしてくれます。」とのコメントをいただきました。

「V93000」は、センサや無線通信など、さまざまな用途に使用される多様な半導体デバイスの試験に対応できる柔軟性を備えています。テスト・システムとしての高い精度とスループットは、お客様の量産への速やかな移行を支え、製品の市場投入までの時間を短縮します。

「V93000」は約 20 年の間、各世代のロジック IC や高速メモリ IC の開発および生産用テスト・システムとして、世界中のファブレス、OSAT そして IDM に支持されています。